

# 数字温度芯片 FAQ

## MY18E20 MY1820 MY18B20Z

## 1. 替代 DS18B20 时程序上如何修改?

MY18E20/MY1820/MY18B20Z 与 DS18B20 标配都是 12bit ADC, 所以, 默认配置情况下, 不需要对程序进行改动。

a. 当要 MY18E20/MY1820/MY18B20Z 进入睡眠时,需要把 Scratchpad 寄存器的 9个字节全部读完,无需发送发送指令,读取函数按如下进行修改:

```
bool ReadTempWaiting SkipRom(uint16 t *iTemp)
{
   uint8 t scrb[sizeof(MY18E20 SCRATCHPAD READ)];
   MY18E20 SCRATCHPAD READ *scr = (MY18E20 SCRATCHPAD READ *) scrb;
   /*读 9 个字节。前两个是温度转换结果,最后字节是前 8 个的校验和--CRC。*/
   if(MY18E20 ReadScratchpad SkipRom(scrb) == FALSE)
   {
       return FALSE; /*读寄存器失败*/
   }
   /*计算接收的前 8 个字节的校验和, 并与接收的第 9 个 CRC 字节比较。*/
   if(scrb[8] != MY_OW_CRC8(scrb, 8))
   {
       return FALSE; /*CRC 验证未通过*/
   }
   /*将温度测量结果的两个字节合成为 16 位字。*/
   *iTemp=(uint16_t)scr->T_msb<<8 | scr->T_lsb;
   return TRUE;
}
b.
    当 MY18E20/MY1820/MY18B20Z 需要使用内置 14bit ADC 时,配置函数按如下进
行修改:
uint8_t trim14=0x01;
boolWriteV3ttrim(uint8_t trim14)
 uint8 t scrb[sizeof(MY18E20 SCRPARAMETERS)];
 MY18E20_SCRPARAMETERS *scr = (MY18E20_SCRPARAMETERS *) scrb;
```



/\*读9个字节。第7字节是系统配置寄存器,第8字节是系统状态寄存器。最后字节是前8个的校验和--CRC。\*/

```
if(MY18E20_ReadParameterV3_SkipRom(scrb) == FALSE)
    return FALSE; /*CRC 验证未通过*/
  }
  /*计算接收的前8个字节的校验和,并与接收的第9个CRC字节比较。*/
  if(scrb[8] !=0xA5)// MY_OW_CRC8(scrb, 8))
    return FALSE; /*CRC 验证未通过*/
  }
  scr->ttrim|= trim14;
  MY18E20 WriteParameters SkipRom(scrb, i)
  return TRUE;
}
bool MY18E20 ReadParameterV3 SkipRom(uint8 t *scr)
{
  int16_t a;
  uint8_t j;
  /*size < sizeof(MY18E20_SCRATCHPAD_READ)*/
  if(OW_ResetPresence() == FALSE)
          return FALSE;
  OW WriteByte(SKIP ROM);
  OW_WriteByte(READ_PARAMETERS);
  for(a=0; a <9; a++)
  {
    *scr++ = OW ReadByte();
  return TRUE;
}
bool MY18E20_WriteParameters_SkipRom(uint8_t *scr)
{
  int16_t a;
  uint8_t j;
  if(OW_ResetPresence() == FALSE)
          return FALSE;
```



```
OW_WriteByte(SKIP_ROM);
OW_WriteByte(WRITE_PARAMETERS);
for(a=0; a < sizeof(MY18E20_SCRPARAMETERS); a++)
{
    OW_WriteByte(*scr++);
}
return TRUE;</pre>
```

c. 当使用 MY18E20-15/MY1820-15/MY18B20Z-15 时,由于是 15ms 测温,程序上做如下修改:

```
ConvertTemp();
Delay_ms(15);
```

## 2. CRC 校验出错,如何解决?

可能情况:

d. DQ 线上存在毛刺。

解决方案:上位机设计应尽量做到 glitch free。常见情况是读时序中由于上位机 MCU 管脚模式切换带来的毛刺,以 STM32 系列为例,当 GPIO 由输出模式切换成上拉输入模式时,会产生一个 1~2us 的毛刺,切换成浮空输入模式或直接操作对于寄存器则不会出现毛刺。另外针对 DQ 上升及下降沿,应针对负载情况选择适当的上拉电阻,常见选择范围为1k~4.7k。

e. 主机 CRC 计算方法有误。

解决方案:请参考下表

属性	数值		
名称	CRC-8/MAXIM		
位宽	8 位		
保护数据	读/写		
多项式	$0x31 (x^8 + x^5 + x^4 + 1)$		
初始数值	0x00		
待测数据的每个字节是否按位反转	是		



在计算后之后, 异或输出之前, 整个数据是否按位反转	是
计算结果与此参数异或	0x00
示例	CRC (0xBEEF) = 0x76

#### f. 主机 DQ 引脚为推挽 (Push-Pull) 输出模式。

某些 MCU 在推挽模式下,当由输出转换为输入时,会出现一段时间的强上拉,而与此同时如果从机输出低电平,则在 DQ 上会产生超过从机输入阈值的中间电平脉冲,导致从机内部计算 CRC 错误。

解决方案: 主机 DQ 引脚设置改为开漏 (Open drain) 模式。

#### 3. MTP 写入失败, 如何解决?

可能情况:

a. 写指令未识别。

解决方案:参考用户手册和应用例程,对写时序进行相应的调整。

b. 等待时间不足。

解决方案: 根据用户手册, 等待合适的转换时间 (40ms)。

#### 4. 主机读到全 0x00, 可能原因及如何解决?

可能情况:

a. 主机硬件电路短路。

解决方案:检查硬件电路,VDD 是否正常,DQ 是否与 GND 短路,上拉电阻是否选取正确,并做针对性修改。

b. 传感器烧坏 (测量 DQ/VDD 到 GND 之间短路)。

解决方案: 更换芯片。

## 5. 主机读到全 0xFF, 可能原因及如何解决?

可能情况:

a. 没有响应存在脉冲。

解决方案:检查上位机是否输出正确波形;检查芯片连接是否正确;检查 DQ 及 VDD 电平是否合理(参见用户手册)。如以上问题排除,则芯片可能损坏。



#### b. 写指令未识别。

解决方案:参考用户手册和应用例程,对写时序进行相应的调整。

c. 读时序不合规范。

解决方案:参考用户手册和应用例程,对读时序进行相应的调整。

d. 控制器 GPIO 口配置不当造成过强的上拉能力。

解决方案:推荐 GPIO 的通用开漏输出模式。

#### 6. 主机读到乱码:可能原因及如何解决?

可能情况:

a. 读时序不合规范。

解决方案:参考用户手册和应用例程,对读时序进行相应的调整。

b. MTP 上电 Load 出错。

解决方案:环境允许则可尝试掉电重启。

c. DQ 上升、下降沿存在毛刺。

解决方案:根据负载情况选择适当的上拉电阻,常见选择范围为1k~4.7k。

## 7. 温度读数不变, 如何处理?

如果数值正常,解决方案:根据用户手册,等待合适的转换时间。如果是两线模式,转换过程中 DQ 要有强上拉。

如果数值不正常,解决方案: 1、等待合适的转换时间; 2、参考 MTP Load 错误解决方案 (尝试掉电重启); 3、参考用户手册和应用例程,对读时序进行相应的调整。

#### 8. 长线缆时,如何保证温度数据读取稳定?

对于 50M 以内长线缆 , 单点测温或多点串联测温情况下:

不同的上位机在时序、寄生参数等存在差异,为了避免电压临界对 IC 可能造成影响,建议 尽可能保证供电电压在 3.3V 及以上进行工作。

保证上拉电阻 < 4.7K,推荐 1K、2.2K、4.7K;长线缆会导致上拉时间变缓慢,会影响下一个时隙的建立。

除以上硬件优化外,根据实际软件的波形需要在总线释放后等待 5us 左右,等待从机构建好稳定 0/1 后再进行读取。

#### 9. 复位时, DQ 端口是输入还是输出?



如果 DQ 为开漏输出模式,外接上拉电阻到 Vdd, DQ 为双向 I/O,当从 DQ 读时,只需将 DQ 置为 1 即可。不需要改为输入模式。

#### 10. 如何进入低功耗模式?

在读完全部 9 个字节后(必须全部读完),就默认进入低功耗模式,无需发送指令。

#### 11. 如何应用芯片里的存储空间?

- 1. 两条指令加在一起可以写入用户存储的五个字节,还有 1 个配置位。这是为了兼容美信的指令。
- 2. 我们有一个扩充的单独的指令,可以直接写入五个字节,更优化。
- 3. 超过五个字节存储,我们也可以写入,需要其他指令,需要时单独发手册。

#### 12. ESD 和浪涌过电压保护方案建议

MY18E20 电气额定值

绝对最大额定值

任意引脚到地电值 -0.5V to +6.0V

供电电压 VDD

电源供电电压 +1.8 to +5.5 V

瞬时电压脉冲允许值: + 8.5V

保护器件:

TVS (Transient Voltage Suppressors),即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管。

TVS 选型要求:

最高工作电压 (Reverse Stand-Off Voltage): VRWM > 5.5V

钳位电压 (Maximum Clamping Voltage): VC < 8.5V

额定功率 PPPM < ×

需要考虑的其它参数:

1) 反向漏电流 IIB: 针对低功耗系统

2) 节电容: 针对数据线 DQ 的保护

TVS 推荐

1. P4KE, Axial 封装, Unit price < 0.2 RMB



Unidirectional	Bidirectional	VRWM(V)	VBR(V)	VC(V)	IPP(A)	IR(μA)	CJ
P4KE6.8A-AT	P4KE6.8CA-AT	5.80	6.45~7.14	10.5	39.0	1000	NA

- 1) 这个型号的缺点是漏电流大,对于电池供电的系统不合适
- 2) 节电容数据未知,估计不会太小。作为数据线保护不合适

## ESDM1051, X4DFN2 封装, Unit price<1.0 RMB

Bidirectional	VRWM(V)	VBR(V)	VC(V)	IPP(A)	IR(μA)	CJ(pF)
ESDM1051	5.5	6.8	10	12.5	0.1	24

- 1) 反向漏电流小,适合电池供电应用
- 2) 节电容很小, 适合数据线 DQ 的保护